



## ASTER Technologies présente une nouvelle génération d'outils « easy-to-use » pour l'analyse de couverture de test.

### Communiqué de presse :

Cesson-Sévigné, France / Electronica 2008, Munich, Allemagne, 9 octobre 2008.

A l'occasion du salon international Electronica, ASTER Technologies, le leader en analyse de testabilité et de couverture de test des cartes électroniques, présente sa nouvelle génération d'outils « *easy-to-use* » pour l'analyse de carte. Cette nouvelle gamme s'appuie sur le puissant outil d'analyse TestWay et permet à ses utilisateurs de quantifier et qualifier la couverture pour de nombreux équipements de test et d'inspection. Plus de 20 modèles de testeurs AOI, AXI, BST, FPT, ICT, MDA sont actuellement supportés.

Ces produits ont été mis au point pour relever les nombreux défis auxquels les responsables "produit" doivent faire face aujourd'hui, comme par exemple: la diminution des cycles de conception/fabrication, la compression des budgets et l'amélioration constante de la qualité des cartes électroniques. Plus précisément, à un moment où les clients s'attendent à acheter des « cartes bonnes uniquement », il devient primordial d'appréhender la capacité d'un test à capturer les défauts de production.

En un mot, « quel est le taux de couverture de test ? ».

Dans ce contexte, cette nouvelle génération de produits a été conçue pour être utilisée par les sous-traitants en électronique (EMS) et leurs clients, les fabricants d'équipement (OEM), pour fournir une mesure de la couverture de test, précise, détaillée et impartiale.

ASTER offre des possibilités de migration de licence qui permettent de convertir une configuration **QuadView-TPQR** vers **TestWay Express** ou **TestWay** mettant ainsi à disposition des capacités d'analyse de plus en plus sophistiquées.

**TestWay Express** va être démontré au salon Electronica en version alpha pour permettre aux clients d'apprécier le concept avant le lancement officiel au premier trimestre 2009.

**QuadView-TPQR** est immédiatement disponible à la vente.

**QuadView-TPQR** est un produit d'entrée de gamme qui permet aux utilisateurs de déterminer la couverture d'un équipement de test ou d'inspection. Cet outil importe directement le programme de test et calcule la couverture. Des rapports détaillés au format HTML et MS-Excel sont générés.

Les données CAO sont importées directement depuis les applications utilisées pour la génération des programmes de test : soit Siemens-TestExpert (FabMaster) ou Mentor Graphics CAMCAD, dans le but de visualiser le schéma d'implantation, le schéma électrique et afin de modéliser les caractéristiques des composants telles que la fonction, la valeur, la tolérance...

**TPQR** analyse la capacité de chaque mesure à détecter un certain spectre de défauts en fonction du type de composant, de la valeur, de la tolérance, de l'environnement de mesure, de l'emplacement du composant, de sa forme, de son empattement...

**TPQR** est construit autour du noyau **QuadView**, visualisateur de nouvelle génération. Mettant à profit les capacités d'affichage du schéma d'implantation et du schéma électrique, il affiche à l'aide d'un code de couleur la couverture tant au niveau des composants que de leurs broches.

Il supporte une large gamme d'équipements de test ou d'inspection utilisée dans l'industrie tel que : Agilent Technologies: 3070, 5DX, SJ10, SJ50; Teradyne: Z1800, Spectrum, GR228x; TAKAYA: APT800, APT900; AEROFLEX: 42xx; SPEA: 4040; TRI; Orbotech; VI Technology; VISCOM; Asset; Corelis; Goepel; JTAG Technologies et XJTAG.

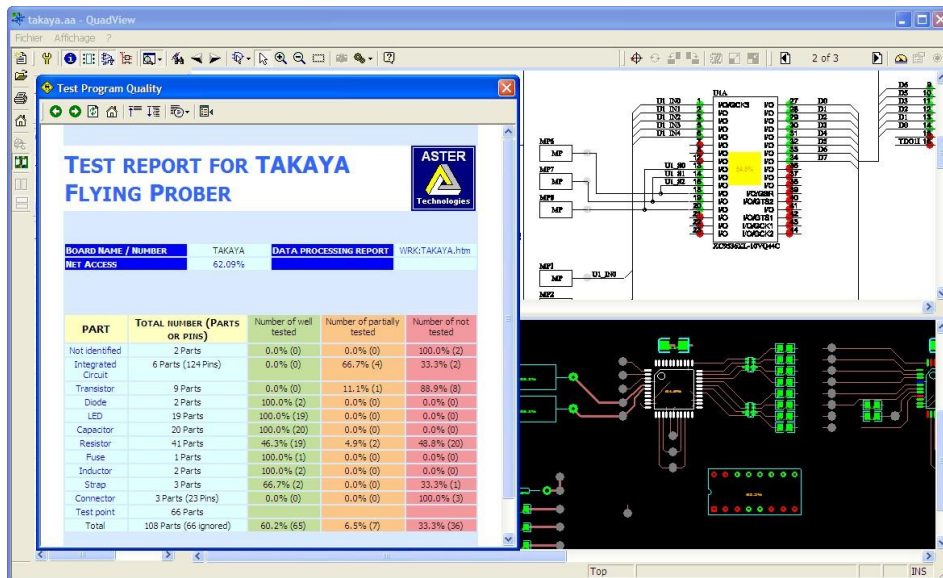


Fig. 1: QuadView-TPQR

**TestWay Express** est plus sophistiqué que QuadView-TPQR car il autorise la combinaison, sur une ligne hétérogène, de différents équipements de test ou d'inspection. La quantification de la couverture est réalisée de façon individuelle pour chaque équipement de test mais également consolidée pour l'ensemble de la ligne. **TestWay Express** identifie rapidement une déficience globale de couverture tout comme une déficience de n'importe quelle étape de test ou d'inspection.

D'une part, les utilisateurs peuvent calculer la couverture théorique produite par différentes stratégies de test, avant le développement des programmes. Cette analyse « what if » combine différentes étapes de test pour identifier la configuration qui produit la couverture la plus élevée. La capacité d'optimiser la couverture de test théorique se traduira par l'augmentation de la qualité de la production et de la précision des diagnostics, la diminution des fausses alarmes et une réduction du temps de test (élimination des redondances de test).

D'autre part, **TestWay Express** peut procéder à une analyse post-développement. Les programmes de test des différents testeurs utilisés dans le cycle de fabrication sont analysés pour calculer la couverture réelle. En conséquence, il est possible de faire une comparaison entre la couverture espérée et celle réellement produite par le programme de test.

**TestWay Express** ne permet pas seulement, d'identifier rapidement le manque de couverture de la stratégie combinée, mais localise également les insuffisances à chaque étape de test ou d'inspection. Le nombre de défauts détectés est analysé en détail pour chaque étape de la ligne de test.

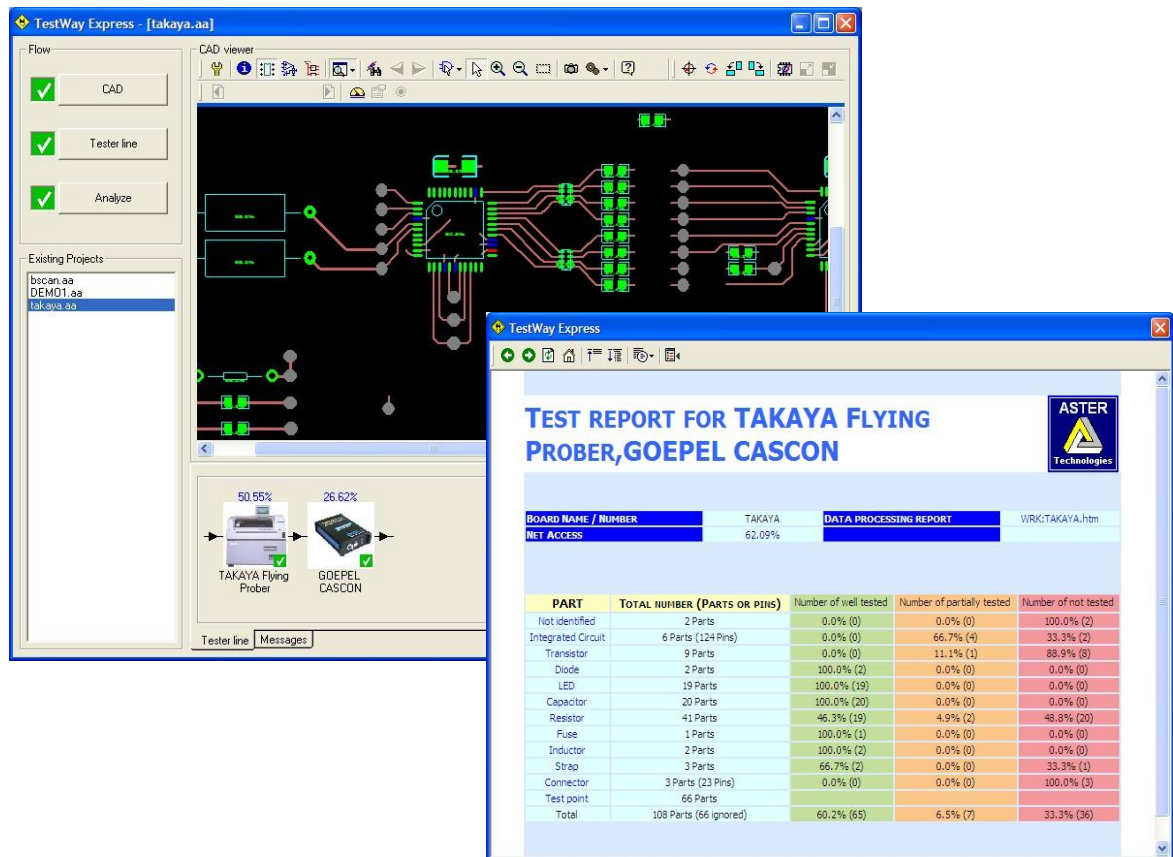


Fig. 2: TestWay Express - Disponible dès le premier trimestre 2009

### Au sujet d'ASTER Technologies

Fondé en 1993, ASTER développe un ensemble de produits traitant de la testabilité, de l'analyse de couverture de test, de la visualisation du schéma électrique et du placement routage, de la gestion qualité et de l'aide à la réparation des cartes électroniques en production. TestWay est une solution validée, largement déployée dans le monde entier qui fournit une approche unique pour tenir compte des exigences de test très tôt dans la chaîne de conception.

Pour de plus amples informations sur la société et ses produits, visitez [www.aster-technologies.com](http://www.aster-technologies.com) ou appelez ASTER au +33 (0)299 83 01 01.